13

Намагниченность и магнитный круговой дихроизм поликристаллических пленок La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃/YSZ

© Ю.Э. Гребенькова¹, А.Э. Соколов¹, Е.В. Еремин¹, И.С. Эдельман¹, Д.А. Марущенко¹, В.И. Зайковский², В.И. Чичков³, Н.В. Андреев³, Я.М. Муковский³

 ¹ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия
 ² Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия
 ³ Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
 E-mail: uliag@iph.krasn.ru

(Поступила в Редакцию 11 сентября 2012 г.)

Исследованы магнитные и магнитооптические свойства, а также морфология поверхности и структура поликристаллических пленок $La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3$ различной толщины. Показано, что поверхность пленок шероховатая с характерным линейным размером в плоскости ~ 30 nm, кристаллиты с линейными размерами 10-20 nm случайно ориентированы в плоскости. Температурные и полевые зависимости намагниченности пленок свидетельствуют об их магнитной неоднородности. В спектрах магнитного кругового дихроизма наблюдается ряд полос, одна из которых при 2.4 eV объясняется вкладом электронов проводимости.

Работа поддержана грантами РФФИ № 11-02-00972 и 12-02-92607.

1. Введение

Соединения манганитов лантана типа La_{1-x}A_xMnO₃ со структурой перовскита представляют большой интерес, так как при различной степени легирования двухвалентным элементом (А) система проходит через цепочку фазовых превращений с разнообразными типами магнитного, структурного и электронного упорядочения [1-3]. Манганиты в виде тонкопленочных материалов отвечают современным требованиям полупроводниковой электроники и обладают эффектом колоссального магнитосопротивления при температурах, близких к комнатной, в малых магнитных полях. В ряде работ [4-6] по изучению пленочных структур манганитов различных составов и степени легирования двухвалентного иона (S²⁺) большое внимание уделено магнитооптическим эффектам, поскольку магнитооптика дает важную информацию об электронной и спиновой структуре материала. Так, например, в [4,5] исследовался полярный эффект Керра, а в [6] — эффект Фарадея в монокристаллических пленках состава La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ (LSMO). Обнаружено, что дырочное допирование манганитов приводит к существенной перестройке магнитооптических спектров в одном и том же энергетическом интервале. Спектры также зависят от толщины образцов [4,5] и технологических условий напыления [6]. Природа пиков, наблюдаемых в магнитооптических спектрах LSMO, до сих пор однозначно не определена. Из всех магнитооптических эффектов магнитный круговой дихроизм (МКД) является наиболее информативным и удобным для измерения, так как он наблюдается только на полосах поглощения и при этом, как правило, отсутствует вклад немагнитной подложки [7]. Насколько нам известно, имеется только

одна работа [8], посвященная исследованию МКД в манганитах, а именно в эпитаксиальных пленках LSMO, осажденных на две различные подложки. Были получены спектры МКД в интервале 1.5-4.5 eV и прослежена температурная зависимость амплитуды наиболее интенсивного пика МКД, центрированного при 3.3 eV. При этом оказалось, что температурная зависимость эффекта может отличаться от температурного поведения намагниченности в зависимости от типа подложки. Настоящая работа посвящена детальному изучению температурных и спектральных зависимостей МКД, а также температурных и полевых зависимостей намагниченности поликристаллических пленок LSMO. Исследование поликристаллических пленок позволяет исключить возможные эффекты, обусловленные напряжениями, возникающими в эпитаксиальной пленке вследствие неполного соответствия параметров решетки пленки и подложки.

2. Образцы и методика эксперимента

Пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ получены методом магнетронного распыления с остаточным давлением в камере перед напылением $3 \cdot 10^{-6}$ Torr [9,10]. Рабочее суммарное давление смеси Ar и O₂ (4:1) составляло $3 \cdot 10^{-3}$ Torr. В качестве подложек использовался монокристаллический оксид циркония, стабилизированный иттрием (YSZ — PDF#82-1241), температура которого при напылении составляла 750°C. Исследованы две серии образцов: 1) с предварительной очисткой поверхности подложки ионной пушкой (образцы с толщинами 30, 80, 90, 100 nm — образцы № 1–4 соответственно), 2) без



Рис. 1. Морфология поверхности пленок: вид сверху и распределение размеров неоднородностей в плоскости образца. *а* — образец № 6, *b* — образец № 3.

предварительной очистки поверхности подложки (образцы с толщинами 20, 50, 75, 90 nm — образцы № 5-8 соответственно). Толщина задавалась временем напыления и определялась ex-situ с помощью рентгеновского флуоресцентного анализа. В соответствии с фазовой диаграммой [1] исследуемые пленки LSMO являются ферромагнитными при комнатной температуре (T_C для объемного материала составляет 350-360 K).

Морфология поверхности полученных пленок исследовалась с помощью атомного силового микроскопа (ACM) Veeco MultiMode. Изображения фрагментов пленки LSMO были получены на электронном микроскопе JEM-2010 с ускоряющим напряжением 200 kV и разрешением 0.14 nm. Пленка отделялась от поверхности подложки и исследовалась на просвет. Предполагается, что структура пленки при этом не изменялась значительно по сравнению с исходным состоянием.

Намагниченность (M) измерена на приборе PPMS-9 (Quantum Design) в интервале температур 5–320 К в магнитном поле до 50 kOe, направленном вдоль и нормально поверхности пленки. Измерения температурных зависимостей намагниченности проводились в двух режимах: 1) образец охлаждался в магнитном поле (FC); 2) образец охлаждался в отсутствие магнитного поля (ZFC). Намагниченность измерялась в процессе нагревания при той же величине поля, при которой происходило охлаждение в режиме FC. Полевые зависимости намагниченности (петли гистерезиса) были получены при T = 5 К.

Спектры поглощения измерены на приборе UV-3600 Shimadzu при комнатной температуре в диапазоне $\sim 1-6 \, {\rm eV}$. При измерении МКД использовалась модуляция состояния поляризации световой волны: от правой круговой до левой круговой поляризации. При наличии в исследуемом образце эффекта МКД коэффициенты поглощения световых волн, поляризованных по правому и левому кругу относительно направления магнитного момента образца, различаются, благодаря чему световой поток, прошедший через образец и падающий затем на фотоприемник, оказывается модулированным по интенсивности. МКД измерялся как разность сигналов при двух противоположных направлениях внешнего магнитного поля. Измерения были проведены в магнитном поле 3 и 6 kOe, направленном вдоль и нормально поверхности пленки, при температурах от 90 до 380 К в энергетическом интервале 1-4.5 eV.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Морфология и структура пленок. На рис. 1 представлены поверхность и спектр распределения неоднородностей пленок, осажденных на подложки с различной обработкой. Видно, что поверхность пленок характеризуется шероховатостью 0.2–0.5 nm по высоте, при этом наблюдаются и более интенсивные неоднородности. В пленках с предварительной обработкой поверхности подложки ионной пушкой (рис. 1, *b*) подобные неоднородности достигают большего размера.



Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения фрагментов образца № 3.

Электронно-микроскопическое изображение фрагментов пленки показано на рис. 2, на котором видны ярко выраженные кристаллиты с линейными размерами 10–20 nm, случайно ориентированные в плоскости. Видно, что в некоторых случаях кристаллиты располагаются на различной глубине, накладываясь друг на друга в два-три слоя. Внутри кристаллитов наблюдается строгое чередование атомных плоскостей.

3.2. Полевая и температурная зависимоснамагниченности. Кривые намагничивания ΤИ всех исследуемых образцов представляют собой симметричные петли гистерезиса с резко различающимися значениями поля насыщения (*H*_s) для ориентаций внешнего поля параллельно и перпендикулярно плоскости образца. Типичный вид этих кривых представлен на рис. 3 на примере образца № 8: магнитное поле приложено в плоскости пленки H_{\parallel} (рис. 3, *a*) и нормально к плоскости пленки H_{\perp} (рис. 3, *b*). В первом случае $H_s \sim 1$ kOe, а во втором оно близко к 8 kOe, что свидетельствует о преимущественно плоскостной магнитной анизотропии в пленке. Кривая намагничивания, измеренная в нормальном поле, отличается от классического случая плоскостной анизотропии наличием гистерезиса, хотя и с очень небольшой величиной коэрцитивной силы. Величина намагниченности в поле насыщения (M_s) одинакова для двух направлений внешнего поля и для образца № 8 составляет 730 emu/cm³. Подобная картина наблюдается для всех исследованных образцов, однако величина M_s зависит от толщины пленок: чем больше толщина пленки, тем больше величина удельной намагниченности.

Типичный вид температурной зависимости намагниченности пленок показан на рис. 4, a. В общем ход кривых M(T) исследуемых образцов соответствует температурному ходу намагниченности массивных материалов [11]. По виду представленных кривых можно заключить, что температура Кюри для ряда образцов варьируется в пределах ~ 300 К, однако для других образцов затянутый хвост намагниченности свидетельствует о наличии в их объеме нескольких ферромаг-



Рис. 3. Полевые зависимости намагниченности образца № 8 при T = 5 К. Поле H параллельно (a) и перпендикулярно (b) поверхности образца.

нитных областей с различными T_C. Такое поведение не связано с обработкой подложки, так как наблюдается в обеих сериях. Наиболее ярко фазовая неоднородность проявилась в полевой зависимости намагниченности образца № 2 (рис. 5, а). При намагничивании в плоскости пленки в малых полях наблюдается очень узкая петля с резко возрастающей намагниченностью, в поле ~ 300 Ое появляется ступенька, и полная петля закрывается вблизи 20 kOe. Подобные картины имеют место в структурах, содержащих слои с различными значениями коэрцитивной силы (H_C) и M_s (см., например, [12]). В отличие от того, что наблюдается в большинстве похожих структур, в рассматриваемом случае петля такого типа регистрируется и в перпендикулярном поле (рис. 5, b). Сравнивая петли гистерезиса в двух ориентациях поля, можно предположить, что в пленке сосуществуют две фазы: одна с преимущественно плоскостной анизотропией и малой величиной Н_C, другая с компонентой анизотропии, нормальной к плоскости, и большой величиной Н_С. Трудно оценить суммарный вклад каждой фазы в намагниченность образца, так как



Рис. 4. Температурные зависимости намагниченности. Поле H параллельно поверхности образца. a — образцы № 5, 6, 2, 8 (толщина пленки в этом ряду растет), режим FC при H = 1 kOe; b — образец № 6, режимы FC и ZFC при H = 50 Oe.



Рис. 5. Полевые зависимости намагниченности образца № 2 при T = 5 К. Поле H параллельно (a) и перпендикулярно (b) поверхности образа.

он определяется как величиной M_s , так и количеством каждой фазы. Вызывает удивление крайне высокая коэрцитивная сила второй фазы, чему в настоящее время нет объяснения.

Для всех исследованных пленок характерно различие между FC- и ZFC-температурными зависимостями намагниченности, полученными в слабом магнитном поле H_{\parallel} . Кривая намагничивания ZFC расположена ниже кривой FC и имеет максимум. Такое поведение, представленное в качестве примера на рис. 4, *b* для образца № 6, может быть обусловлено хаотическим распределением осей легкого намагничивания кристаллитов аналогично поведению магнитно-разупорядоченных кластеров [13]. Температура необратимости, при которой кривые FC и ZFC расходятся, понижается при уменьшении толщины пленок.

3.3. Поглощение и магнитный круговой дихроизм. Спектральные зависимости коэффициента поглощения, измеренные для всех образцов двух серий при комнатной температуре, подобны друг другу. Типичная кривая представлена на рис. 6, *a*, она характеризуется плавным изменением величины поглощения при увеличении энергии фотона с одним широким максимумом в области ~ 1.5 eV. В то же время на

спектральной зависимости МКД, полученной при комнатной температуре, в том же энергетическом интервале наблюдается несколько полос (рис. 6, *b*). Для всех исследуемых образцов полоса, центрированная при ~ 1.7 eV, близка к полосе в спектре поглощения, а наиболее интенсивный пик МКД, наблюдаемый при 3.3 eV, соответствует данным [8] (рис. 6, *b*). Следует заметить, что амплитуда этого пика, так же как намагниченность, не пропорциональна толщине пленок (рис. 6, *c*).

Температурные зависимости спектров МКД одинаковы для двух серий пленок с различной обработкой подложки. Типичная картина такой зависимости изображена на рис. 7 для образцов № 2 и 8. Интересно, что в спектрах МКД при понижении температуры появляется относительно слабая полоса противоположного знака вблизи 2.4 eV.

Для того чтобы определить природу МКД при разных энергиях, спектры были аппроксимированы гауссовыми кривыми (рис. 8, а), подгоночными параметрами которых являлись величина эффекта (амплитуда), положение и ширина линии. Наилучшее совпадение рассчитанных спектров с экспериментальными было получено в предположении четырех гауссовых полос с энергия-MИ $1.7 (13707 \text{ cm}^{-1}), 2.4 (18860 \text{ cm}^{-1}), 3.1 (23322 \text{ cm}^{-1}),$ 3.3 $(26503 \text{ cm}^{-1}) \text{ eV}$ (полосы 1-4 на рис. 8, *a* соответственно). Обнаружено, что температурные зависимости амплитуды полос на рис. 8, b, приведенные по модулю, отличаются друг от друга. Температурный ход амплитуды полос одинакового знака (кривые 1, 3, 4) близок к температурной зависимости намагниченности образца № 8 (кривая 5), однако амплитуда полосы с положительным значением МКД (кривая 2) изменяется по другому закону.

Одинаковая форма кривых 1, 3–5 свидительствует о том, что МКД при соответствующих энергиях определяется в основном разностью заселенностей подуровней основного состояния ионов Мп, ответственной за намагниченность образца. Поэтому МКД полос 1, 3, 4 может быть сопоставлен внутриионным электронным переходам или переходам с переносом заряда между локализованными ионами Мп, что будет обсуждаться далее. Отличие формы кривой 2 от остальных, очевидно, связано с другой природой МКД.

Наблюдаемую зависимость намагниченности от толщины образцов можно связать с нарушением магнитного порядка на границе раздела LSMO/YSZ, т.е. с образованием некоторого интерфейса, обладающего другими магнитными свойствами, аналогично тому, как предполагалось в работах [14,15] для объяснения особенностей туннелирования в гетероструктурах LSMO-диэлектрик-LSMO. Образование интерфейса уменьшает суммарную намагниченность образца. Глубина интерфейса не зависит или слабо зависит от толщины пленки; таким образом, его влияние на магнитные и магнитооптические свойства тем меньше, чем больше толщина пленки.



Рис. 6. Спектр поглощения образца № 2 (*a*), спектральная зависимость удельного МКД для образцов № 1 (*I*), 2 (*2*) и 4 (*3*) в поле H_{\perp} (*b*) и зависимость величины МКД при 3.3 eV от толщины образцов двух серий (*c*). T = 295 K.

Различие кривых FC и ZFC можно объяснить наличием случайно ориентированных кристаллитов в структуре образца (рис. 2). При охлаждении образца в отсутствие поля вектор намагниченности каждого кристаллита ориентирован по его оси легкого намагничивания, и суммарная намагниченность образца близка к нулю. Наложение магнитного поля в процессе нагревания образца приводит к постепенной подстройке магнитных моментов кристаллитов к направлению поля, и при некоторой температуре необратимости кривые FC и ZFC сливаются. Ширина максимума на кривой ZFC обусловлена разбросом характеристик кристаллитов: размеров, величин анизотропии, ориентаций осей легкого намагничивания, а также напряжениями на границах. Такая картина, как было отмечено ранее, наблюдалась в [13] и была объяснена магнитным разупорядочением кластеров.

Как указывалось выше, на спектральной зависимости МКД в энергетическом диапазоне от 1 до 3.5 eV выделяются четыре полосы, которые обусловлены различными электронными переходами. Максимум при $\sim 1.7\,{
m eV}$ (рис. 6, b) близок по энергии к максимуму поглощения $(\sim 1.5 \,\mathrm{eV}, \,\mathrm{puc.}\, 6, a),$ положение которого в свою очередь согласуется с положением низкочастотной полосы поглощения, наблюдается в [16]. Природа данного пика обсуждалась различными авторами и приписывалась как *d*-*d*-переходам, так и переходам, связанным с переносом заряда O2*p*-Mn3*d*. В частности, в [6] этот максимум был отнесен к разрешенному по спину *d*-*d*-переходу ${}^{5}E_{g} - {}^{5}T_{2g}$ в ионах Mn³⁺. Остальные электронные переходы, выявленные по спектральной зависимости МКД пленки LSMO, также имеют ряд различных интерпретаций. Однако дырочное допирование LaMnO₃, что фактически имеет место в La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃, приводит к существенной перестройке оптического спектра образца. Интенсивность полос может изменяться, а сами полосы смещаться в сторону меньших или больших энергий. Другое следствие такого допирования — появление октаэдрических комплексов (MnO₆)⁸⁻. Магнитооптика комплексов (Mn⁴⁺O₆)⁸⁻ была изучена в работе [17] на примере пирохлора A2Mn2O7. С помощью эффекта Керра были выявлены полосы вблизи 2.6 и 3.1 eV, приписанные d-d-переходам ${}^4\!A_{2g}-4T_{2g}$ и ${}^4\!A_{2g}-{}^4T_{1g}$ в ионах Mn⁴⁺. Основываясь на результатах работы [17], авторы [6] связали несимметричную форму пика в спектре фарадеевского вращения с близостью двух d-d-переходов в ионах Mn^{4+} с различной интенсивностью, центрированных при 2.7 и 3.1 eV. Как видно из рис. 7, пик с максимумом 3.3 eV в спектре МКД также обладает несимметричной формой. Разложение данного спектра на составляющие действительно показало наличие пика в области 3.1 eV, который может быть описан переходом, связанным с Mn⁴⁺. Возвращаясь к пику, центрированному при 3.3 eV, следует заметить, что его амплитуда намного интенсивнее других. Подобное поведение свидетельствует о природе перехода, отличной от природы низкоэнергетических полос. Большинство авторов связывает этот переход с переносом заряда O2p-Mn3d. Следует заметить, что для манганитов форма спектральной зависимости МКД, представленная на рис. 6, b, аналогична форме спектра полярного эффекта Керра [4,5,18]. В частности, в [5] были выявлены некоторые полосы, соответствующие полосам МКД. Максимумы в области 2.5 и 3.1 eV



Рис. 7. Спектры МКД при различных температурах в поле $H_{\parallel} = 3$ kOe для образцов № 2 (a) и 8 (b).

были приписаны d-d-переходам в ионах Mn, а пик при 3.3 eV — переносу заряда между кислородом и марганцем. Однако интерпретация спектральной зависимости эффекта Керра в термах электронных переходов представляет собой нетривиальную задачу, так как измеряемое вращение Керра является сложной функцией диагональных и недиагональных компонентов тензора оптической проводимости.

Сравнение обнаруженной в спектре МКД полосы при ~ 1.7 eV с данными работы [18] позволяет связать ее с переходом $e_g - e_g$ в ионе Mn³⁺, так как этот переход наблюдается в структуре LaMnO₃, в которую не входят ионы Mn⁴⁺. В свою очередь, основываясь на данных [17], полосу в области 3.1 eV следует отнести к d-d-переходу ${}^{4}A_{2g} - {}^{4}T_{1g}$ в ионах Mn⁴⁺. Не вызывает сомнений то, что наиболее интенсивная полоса, центрированная при 3.3 eV, относится к переходу с переносом заряда O2p-Mn3d.

Наибольший интерес в спектре МКД вызывает полоса при 2.4 eV. Отличительной особенностью этой полосы является температурная зависимость ее амплитуды, представленная на рис. 8, b (кривая 2), которая не соответствует температурной зависимости намагничен-



Рис. 8. Аппроксимация гауссовыми кривыми экспериментальных спектров МКД (*a*), температурное поведение амплитуд четырех полос МКД (кривые 1-4) и намагниченности (кривая 5) в поле $H_{\parallel} = 3$ kOe, образец № 8 *b*).

ности. Для остальных переходов температурный ход МКД соответствует зависимости M(T). Такое различие можно объяснить вкладом в МКД электронов проводимости, появление которых обусловлено допированием. В работе [19] на основании изучения спектров оптической проводимости было показано, что по мере увеличения концентрации стронция в монокристаллах $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ до x = 0.3 этот вклад становится преобладающим. С другой стороны, электроны проводимости поляризованы по спину в магнитном поле ионного остова, как это показано в [20,21]. При этом степень спиновой поляризации существенно различается в глубине образца и на поверхности. Температурная зависимость намагниченности на поверхности пленки LSMO (рис. 4 в [20]) близка по форме к кривой 2, представленной в настоящей работе на рис. 8, b. В свою очередь влияние на спиновую поляризацию электронов проводимости может оказывать как свободная поверхность, так и межфазная граница между пленкой и подложкой [22].

4. Заключение

В работе изучено магнитное и магнитооптическое поведение пленок $La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3/YSZ$ различной толщины и с различной обработкой подложки. Обнаружено, что предварительная очистка поверхности подложки не оказала существенного влияния на свойства пленок.

Показано, что структура исследуемых образцов состоит из ярко выраженных кристаллитов с линейными размерами 10–20 nm, случайно ориентированных в плоскости. Магнитное поведение демонстрирует рост удельной намагниченности с увеличением толщины пленок, что объясняется влиянием интерфейсного слоя на границе LSMO — диэлектрик. Характерный вид температурной и полевой зависимостей намагниченности пленок свидетельствует об их магнитной неоднородности. Различие между FC- и ZFC-температурными зависимостями намагниченности в слабом магнитном поле и максимум кривой ZFC могут быть обусловлены хаотическим распределением осей легкого намагничивания кристаллитов в объеме пленки.

Величина магнитного кругового дихроизма, так же как и намагниченность, не пропорциональна толщине образцов. Полосы МКД, наблюдаемые во всем температурном интервале ниже T_C, центрированы при 1.7, 3.1 и 3.3 eV. Они соотносятся с переходами $e_g - e_g$ в ионе Mn^{3+} , ${}^{4}A_{2g} - {}^{4}T_{1g}$ в ионах Mn^{4+} и переходом с переносом заряда O2p-Mn3d соответственно. Для указанных переходов температурная зависимость амплитуд соответствует температурному ходу намагниченности образца. При охлаждении образца до температур ниже Т_С приблизительно на 100 К в спектре МКД появляется относительно слабая полоса противоположного знака вблизи 2.4 eV. Отличительной особенностью данной полосы является температурная зависимость ее амплитуды, не соответствующая температурной зависимости намагниченности. Такое различие можно объяснить вкладом в МКД электронов проводимости, на спиновую поляризацию которых могут оказывать влияние как свободная поверхность, так и граница раздела пленки с подложкой.

Авторы благодарят А.Е. Пестуна (НИТУ "МИСиС") за приготовление мишеней.

Список литературы

- O. Chmaissem, B. Dabrowski, S. Kolesnik, J. Mais, J. Jorgensen, S. Short. Phys. Rev. B 67, 094 431 (2003).
- [2] Я.М. Муковский. ЖРХО им. Д.И. Менделеева 45, 5-6, 32 (2001).
- [3] А.Ю. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. УФН 171, 2, 121 (2001).
- [4] S. Yamaguchi, Y. Okimoto, K. Ishibashi, Y. Tokura. Phys. Rev. B 58, 11, 6862 (1998).
- [5] H.L. Liu, K.S. Lu, M.X. Kuo, L. Uba, S. Uba, L.M. Wang, H.-T. Jeng. J. Appl. Phys. 99, 043 908 (2006).

- [6] Ю.П. Сухоруков, А.М. Москвин, Н.Н. Лошкарева, И.Б. Смоляк, В.Е. Архипов, Я.М. Муковский, А.В. Шматок. ЖЭТФ 71, 6, 139 (2001).
- [7] A.D. Buckigham, P.J. Stephens. Ann. Rev. Phys. Chem. 17, 399 (1966).
- [8] T.K. Nath, J.R. Neal, G.A. Gehring. J. Appl. Phys. 105, 07D709 (2009).
- [9] E.A. Antonova, V.L. Ruzinov, S.Yu. Stark, V.I. Tchitchkov. Supercond. Phys. Chem. Technol. 14, 8, 1624 (1991).
- [10] В.А. Козлов, Я.М. Муковский, О.М. Урман, А.В. Шматок. Письма в ЖТФ 22, 6, 5 (1996).
- [11] H.Y. Hwang, S-W. Cheong, N.P. Ong, B. Batlogg, Phys. Rev. Lett. 77, 2041 (1996).
- [12] J.-M. Liu, Q. Huang, J. Li, C.K. Ong, Z.G. Liu. Appl. Phys. A 69, S663 (1999).
- [13] K. Dorr. J. Phys. D 39, R125 (2006).
- M. Bibes, Ll. Balcells, S. Valencia, J. Fontcuberta, M. Wojcik,
 E. Jedryka, S. Nadolski. Phys. Rev. Lett. 87, 067 210 (2001).
- [15] M. Izumi, Y. Ogimoto, Y. Okimoto, T. Manako, P. Ahmet, K. Nakajima, T. Chikyow, M. Kawasaki, Y. Tokura. Phys. Rev. B 64, 064 429 (2001).
- [16] Н.Н. Лошкарева, Ю.П. Сухоруков, В.Е. Архипов, С.В. Окатов, С.В. Наумов, И.Б. Смоляк, Я.М. Муковский, А.В. Шматок. ФТТ, 41, 3, 475 (1999).
- [17] E.A. Balykina, E.A. Ganshina, G.S. Krinchik, A.Yu. Trifonov, I.O. Troyanchuk. J. Magn. Magn. Mater. 117, 259 (1992).
- [18] L. Uba, S. Uba, L.P. Germash, L.V. Bekenov, V.N. Antonov. Phys. Rev. B 85, 125 124 (2012).
- [19] Л.В. Номерованная, А.А. Махнев, А.Ю. Румянцев. ФТТ 41, 8, 1445 (1999).
- [20] J.-H. Park, E. Vescovo, H.-J. Kim, C. Kwon, R. Ramesh, T. Venkatesan. Phys. Rev. Lett. 81, 9, 1953 (1998).
- [21] M.S. Osofsky, B. Nadgorny, R.J. Soulen, Jr, P. Broussard, M. Rubinstein, J. Byers, G. Laprade, Y.M. Mukovskii, D. Shalyatev, A. Arsenov. J. Appl. Phys. 85, 8, 5567 (1999).
- [22] V. Garcia, M. Bibes, A. Barthelemy, M. Bowen, E. Jacquet, J.-P. Contour, A. Fert. Phys. Rev. B 69, 052 403 (2004).